

**KEITHLEY**

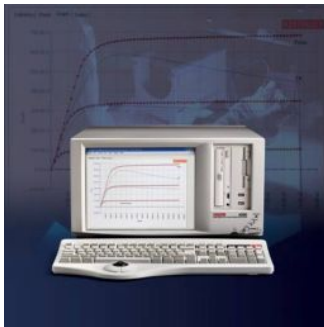
ケースレーインストルメンツ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1  
ニューピア竹芝ノースタワー13F  
TEL (03)5733-7555・FAX (03)5733-7556  
<http://www.keithley.jp>

2007年4月5日

報道関係各位

ケースレーインストルメンツ株式会社  
マーケティング  
さとう かなえ  
佐藤 香苗  
[info.jp@keithley.com](mailto:info.jp@keithley.com)



高解像度画像はこちら:

<http://www.ggcomm.com/KEI/4200Gossamer.jpg>

## ケースレー 先端半導体デバイス試験向け パルス IV オプションの 機能強化モデルを販売開始

2007年4月5日 – 先進の電子計測器・システムの世界的リーダーである Keithley Instruments Inc. (NYSE : KEI) は、定評ある 4200-SCS 型半導体特性評価システムのパルス IV ハードウェアオプションおよび試験環境ソフトウェアの機能強化モデルを発表、本日より国内での販売を開始する。DC、パルス、信頼性のオールインワンである研究室グレードのシステムにターンキー・ソリューションを提供する新アプリケーションパッケージが登場した。機能強化されたパルスジェネレータ・カードと新しいスコープ・カードは、先端半導体の研究、生産に携わる研究者に、強力な新機能を提供する。大幅に刷新された 4200-PIV パッケージと 2 つの新しいアプリケーション・ソリューションにより、4200-SCS の応用範囲がフラッシュメモリ試験、ハイパワーRF デバイス試験、先端半導体材料のパルス試験などの新しい領域に広がる。

## 強化された試験ハードウェア

ケースレーの新しいソリューションでは、ハードウェア機能が大幅に改良されている。新しいパルスジェネレータ・カードである 4205-PG2 型は、特許申請中の Segment ARB™モードなどの新機能を搭載し、簡単なラインセグメントを使用して、基本パルス機能では生成できない複雑な波形を容易に作成できる。これはメモリセルの特性評価や寿命試験に複雑な波形パターンが必要となるフラッシュメモリ試験では必須の機能である。また、4205-PG2 型には任意波形発生機能 ARB モードがあり、寿命がほぼ無制限で制御の容易な高耐久性出力リレーが内蔵されている。フラッシュ試験で使用する外部リレーを用意する必要がなく、耐久試験時間を大幅に短縮する。

さらに、4200-SCS 型の電源のパワーアップによりシステム構成の自由度が飛躍的に拡大し、1 台の 4200-SCS 型に最大 4 個のパルスジェネレータを装着できるようになった。それぞれの 4205-PG2 型カードはチャンネルを 2 個持っており、1 台の 4200-SCS 型には最大 8 個のパルスチャンネルを装備できる。さらに、4205-PG2 型には外部トリガソースのための trigger-in があり、1 台に複数のパルスカードを装着した場合、10n 秒以内で相互に同期できる。

## 先端分野の課題を克服するアプリケーション・ソリューション

ケースレーの新しいアプリケーション・ソリューションは、機能強化された 4205-PG2 型パルスジェネレータ・カードと新しいアプリケーション・ソフトウェアで構成される。4200-PIV-Q パッケージは、III-V 材料や LDMOS などの技術ベースの RF デバイスやハイパワーFET でのパルス I-V 試験や信号解析に最適である。使いやすく、柔軟性の高い 4200-PIV-Q 型は、最大±38V、800mA、30W のパルス性能を有し、測定パラメータはハイパワーアプリケーション向けに設計されている。4200-PIV-Q 型の主要機能のひとつに、パルス幅 500n 秒～DC での静止点(Q ポイント)試験 (ゼロ点以外のアイドル状態からのパルス発生が可能)がある。

強力で即使用できるフラッシュメモリ試験ソリューション 4200-FLASH パッケージは、フラッシュメモリに関する 3 つの主要試験である特性評価、耐久試験、ディスターブ試験を実行する。アプリケーションパッケージが DC とパルスの試験を自動的に切り換えるため、外部スイッチは不要である。内蔵の高耐久性出力リレーの採用により、他の大半のフラッシュテストで必要となる外部半導体リレーが不要であるため、寿命試験時間が大幅に短縮され、効率と使いやすさに優れている。さらに、4200-FLASH パッケージにはフラッシュ試験用のコードとプロジェクトが含まれているので、試験のセットアップ、スタートアップは容易である。

4200-PIV-A パッケージは、定評ある 4200-PIV パッケージの機能強化モデルで、先端 CMOS デバイスの特性評価のために開発された。強化された機能には、旧モデルと比較して非常に微小な電流分解能の達成(100nA)、パルス/DC 試験を組み合わせる直感的で使いやすいユーザインタフェースの採用などがある。

## 進化を続ける先進ソフトウェア

KTEI (Keithley Test Environment Interactive)の新バージョン V6.2 では、多くのソフトウェアの改良がなされた。たとえば、外部 PC から 4200-SCS 型を制御する場合、Ethernet 接続、内蔵パルスジェネレータ/スコープ・ハードウェアのリモートコール、および UTM (User Test Modules)内でのオンボードテストのリモート実行が可能になった。また、ユーザは、使いやすい GUI インタフェースを介して、スイッチマトリックスコントローラや PIV 試験など多くの一般的なアプリケーションの個々の UTM とやりとりできるようになった。また、KTEI V6.2 はユーザの PC 上にスタンドアロン・ソフトウェアパッケージとしてインストールして、オフラインでのテスト作成や、テスト後のデータ解析などに利用できる。

既に 4200-SCS 型をお使いの方は新発売のアプリケーション・ソリューションに簡単にアップグレードできるので、既存資産を継承でき、設備投資を抑え、全体の試験コストを低減できる。

### 価格と納期:

4205-PG2 型パルスジェネレータ・カード 1,330,000 円

アプリケーション・ソリューション:

4200-PIV-A パッケージ 3,994,000 円

4200-PIV-Q パッケージ 5,325,000 円

4200-FLASH パッケージ 2,662,000 円

出荷開始: 2007 年 5 月 1 日

詳細: ケースレーの半導体特性評価システムの詳細は、ケースレーインスツルメンツ株式会社にお問い合わせください。

### お問い合わせ先

ケースレーインスツルメンツ株式会社

東京: 03-5733-7555 (電話)

03-5733-7556 (FAX)

〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1

ニューピア竹芝ノースタワー13 F

大阪: 06-6190-0014 (電話)

06-6190-0017 (FAX)

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9番  
第11マイダビル

E-mail: [info.jp@keithley.com](mailto:info.jp@keithley.com)

Internet: [www.keithley.jp](http://www.keithley.jp)

#### ケースレーインストルメンツについて

半世紀以上にわたり世界の計測をリードしてきたケースレーインストルメンツは、工程管理、製造試験、開発設計、基礎研究での計測需要に応える電気測定ソリューションを DC から RF まで幅広く提供しています。ケースレーの先進のハードウェア、ソフトウェアは、全世界の技術者、研究者によって、最先端の材料研究、半導体デバイス、ウェーハ特性評価、電子部品やワイヤレスデバイスをはじめとする最終製品製造試験など、さまざまな局面で使用されています。ケースレーは、強みである測定技術とアプリケーションノウハウを併せ持つことにより、世界中のお客様の製品やプロセスの改善、市場投入時間を図るための支援を行っています。

本プレスリリースに記載されている製品名、会社名は、各所有会社の商標です。

###